

# 특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특허 제 10-2687717 호

Patent Number

출원번호 제 10-2022-0162458 호

Application Number

출원일 2022년 11월 29일

Filing Date

등록일 2024년 07월 18일

Registration Date

발명의명칭 Title of the Invention

반도체 소자의 성능 테스트에 대한 모니터링을 수행하는 전자장치 및 방법

특허권자 Patentee

주식회사 네패스아크(150111-\*\*\*\*\*)

충청북도 괴산군 청안면 네패스로 42

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual  
Property Office

2024년 07월 18일

특허청장

COMMISSIONER,

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김완기



QR코드로 현재기준  
등록사항을 확인하세요



# 등록사항

특 허 제 10-2687717 호  
Patent Number

발명자 Inventors

황필선(190418-\*\*\*\*\*)  
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

연재명(190424-\*\*\*\*\*)  
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

오지영(220104-\*\*\*\*\*)  
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32